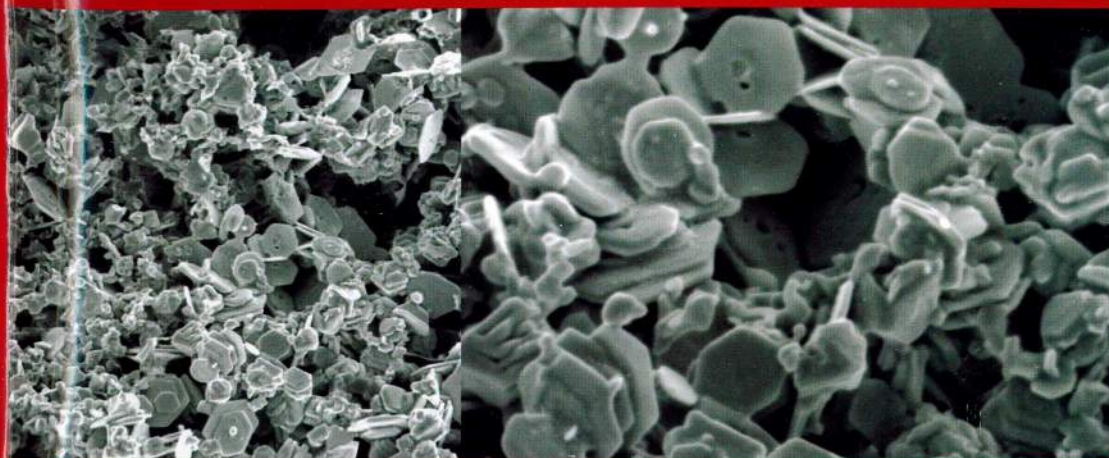


XXVII

РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

И 5-АЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО
ЧЛ. КОРП. РАН Н.А. КИСЕЛЕВА



RCEM 2018

ЧЕРНОГОЛОВКА

26-30 АВГУСТА
2018 ГОДА

О конференции:

Национальные конференции по электронной микроскопии проводятся Научным Советом по электронной микроскопии РАН при участии Института кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН и Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН на протяжении более чем 50 лет.

Такие национальные конференции стали для российских ученых центральным информационным полем, обеспечивающим знаниями и навыками работы на новом высокотехнологичном оборудовании, научными контактами и способствующими привлечению молодежи. Как правило, эти конференции проводятся раз в два года.

XXVII конференция пройдет 28-30 августа 2018 года в городе Черноголовка Московской области и будет посвящена памяти выдающегося ученого чл. корр. РАН Н.А. Киселева. По уже установившейся традиции перед началом конференции, 26-27 августа 2018 года пройдет Школа для молодых ученых. На Конференцию и Школу будут приглашены зарубежные ученые и фирмы-производители оборудования. Доклады будут опубликованы в виде отдельного сборника, часть - как статьи в научных журналах списка Web of Science.

Организаторы:

- Научный совет РАН по электронной микроскопии;
- Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» РАН;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов» РАН;
- Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».



Организационный комитет:



Ковальчук Михаил Валентинович,
председатель организационного комитета,
председатель оргкомитета, член. корр. РАН, президент
НИЦ "Курчатовский институт"



Каневский Владимир Михайлович,
заместитель председателя организационного ко-
митета, руководитель Института кристаллографии
имени А.В. Шубникова - структурного подразделения
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН



Рощупкин Дмитрий Валентинович,
заместитель председателя организационного коми-
тета, ВРИО директора ИПТМ РАН

Кумсков А.С.,
ученый секретарь,
ФНИЦ «Кристаллография
и фотоника» РАН

Гусарова Н.Н.,
секретарь,
ФНИЦ «Кристаллография
и фотоника» РАН

Программный комитет:



Авилов Анатолий Сергеевич,
председатель программного комитета, заведующий
Отделом электронной кристаллографии Института
кристаллографии им. А.В. Шубникова ФГУ «ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника» РАН»

Члены организационного комитета:

Авилов А.С.,

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

Алексеева О.А.,

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

Васильев А.Л.,

НИЦ «КИ», организатор школы для молодых специалистов

Гурович Б.А.,

НИЦ «КИ»

Дьякова Ю.А.,

НИЦ «КИ»

Казьмирук Л. А.,

ИПТМ РАН

Казьмирук В.В.,

ИПТМ РАН

Кашкаров П.К.,

НИЦ «КИ»

Латышев А.В.,

ИФП СО РАН

Николайчик В.И.,

ИПТМ РАН

Осипов Н.А.,

ИПТМ РАН

Саранин А.А.,

ИАПУ ДВО РАН

Толстихина А.Л.,

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

Приглашенные зарубежные докладчики:



Филипп Буффат

(Philippe Buffat)

Швейцария



Дударев С.Л.

(Sergei Dudarev)

Англия



Лебедев О.И.

(Oleg Lebedev)

Франция



Меши Л.

(Meshi Louisa)

Израиль



Чувилин А.

(Andrey Chuvilin)

Испания



Миллер Р. Дж. Двейн

(Miller R.J. Dwayne)

Германия



Николопулос С.

(Stavros Nikolopoulos)

Бельгия



Марк Л.

(Laurence D. Marks)

США



Олейников П.

(Peter Oleynikov)

Швеция



Эйндоу М.

(Mark Aindow)

США



Орлова Е.

(Elena Orlova)

Англия

МОДЕЛЬ RSEM2018

XXVII РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ...

Мероприятие проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Проект № 18-02-20090

5-АЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Мероприятие проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Проект № 18-32-10025

26
августа

- новые методы микроскопии, электронной дифракции и микроанализа;
- микроскопия и сопряженные методы в материаловедении

27
августа

- применение микроскопии в биологии и медицине, Крио-ЭМ;
- микроскопия и сопряженные методы в материаловедении;
- методы электронной микроскопии и микроанализа в исследовании предметов культурного наследия;
- микроскопия и сопряженные методы в материаловедении

28
августа

- новые методы просвечивающей растровой электронной микроскопии, электронной дифракции и микроанализа. Новые приборы, элементы электронной оптики, детекторы и обработка изображений;
- электронная микроскопия, электронная дифракция и микроанализ в исследовании новых материалов;
- другие применения электронной микроскопии и комплементарных методов

29
августа

- электронная микроскопия в химии, геологии и метеоритоведении;
- растровая электронная и ионная микроскопия. In-situ исследования в РЭМ;
- крио-ЭМ и применение электронной, конфокальной сканирующей микроскопии в биологии и медицине

30
августа

- сканирующая зондовая микроскопия;
- электронная и ионная литография. Микроскопия в современных технологиях;
- методы электронной микроскопии и микроанализа в исследовании предметов культурного наследия

ВЫСТАВКА И ТЕХНОПАРК

В этом году в рамках конференции и школы молодых ученых проходит выставка производителей электронных микроскопов и сопутствующего оборудования.

В Технопарке на втором этаже Вам будут представлены приборы и демонстрация их возможностей в режиме реального времени. Помимо электронных будут представлены флуоресцентный и ближнепольный микроскопы.

26 августа Школа молодых ученых

09.50	Открытие школы
	Новые методы микроскопии, электронной дифракции и микроанализа
10.00-10.40	«Why TEM?» <i>Лебедев О.И.</i>
10.40-11.20	«How quantitative are (S)TEM EDS microanalysis and mapping at the nanometer scale and beyond?» <i>Buffat P.A.</i>
11.20-11.40	Кофе-брейк
11.40-12.20	«ALCHEMI and applications of the ordering tie line approach» <i>Эйндоу М.</i>
12.20-12.50	«In situ ПЭМ и новые возможности исследования формирования, превращений неорганических материалов» <i>Колосов В.Ю.</i>
12.50-13.20	«Наномасштабный химический анализ материалов методом атомно-зондовой томографии» <i>Рогожкин С.В.</i>
	Микроскопия и сопряженные методы в материаловедении
13.20-13.50	«Эффекты облучения материалов быстрыми тяжёлыми ионами» <i>Волков А.Е.</i>
13.50-14.40	Обед
14.40-15.00	«Совместное использование комплекса разномасштабных методов при исследовании функциональных наноматериалов» <i>Пашаев Э.М.</i>
15.00-15.15	«Электронная микроскопия силицидов редкоземельных металлов» <i>Каратеев И.А.</i>
15.15-15.30	«Исследование гетероструктур на основе АЗВ5 методами электронной микроскопии» <i>Трунькин И.Н.</i>
15.30-15.45	«Высокоразрешающая низковольтная растровая электронная микроскопия пористых полимерных систем» <i>Архарова Н.А.</i>
15.45-16.00	«Исследование структуры микрокристаллического бериллия методами электронной микроскопии» <i>Хмеленин Д.Н.</i>
16.00-16.15	«Структура нанокомпозитов «углеродный носитель - наночастицы металлов» <i>Суфиянова А.Э.</i>
16.15-16.30	«Исследование микроструктуры магнитных металлических периодических структур» <i>Чесноков Ю.М.</i>
16.30-16.45	«Управление морфологией поверхности кремния на основе процессов самоорганизации» <i>Рогило Д.И.</i>
16.45-17.15	Кофе-брейк

26 августа Школа молодых ученых



	Новые методы микроскопии, электронной дифракции и микроанализа
17.15-17.30	«In situ отражательная электронная микроскопия для изучения атомных процессов на поверхности кристалла» <i>Ситников С.В.</i>
17.30-17.45	«Пороговая обработка электронно-микроскопических снимков наночастиц и аппроксимация моделированных изображений к экспериментальным в задачах дисперсионного анализа» <i>Шведченко Д.О.</i>
17.45-18.00	«Приготовление электронно-микроскопических образцов поверхностных наноструктур методом фокусированного ионного пучка» <i>Волков Р.Л.</i>
18.00-18.15	«Количественный трехмерный анализ по данным электронно-ионной и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии» <i>Михуткин А.А.</i>
18.15-18.30	«Локализация области формирования LEEVI эффекта в голубых светодиодах с МКЯ InGaN/GaN» <i>Вергелес П.С.</i>
18.30-18.45	«Метод восстановления волновой функции электрона и его применение для исследования пиролитических углеродных материалов» <i>Приходько А.С.</i>
18.45-20.00	Стендовая сессия и круглый стол

27 августа Школа молодых ученых

Применение микроскопии в биологии и медицине, КРИО-ЭМ	
10.00-10.40	«Cryo electron microscopy in the 21st century: Discoveries, Challenges, and Prospects» <i>Орлова Е.В.</i>
10.40-11.10	«Структурная биология: из XX в XXI век» <i>Соколова О.С.</i>
11.10-11.40	Кофе-брейк
Микроскопия и сопряженные методы в материаловедении	
11.10-11.50	«Взаимодействие микроорганизмов с неорганическими веществами: образование биогенных наночастиц» <i>Суворова Е.И.</i>
11.50-12.30	«Methodology for structure solution of complex aluminides using novel electron crystallography methods» <i>Меши Л.</i>
12.30-13.00	«Применение методов аналитической микроскопии в разработке новых материалов авиационного назначения и оптимизации технологии их производства» <i>Лукина Е.А.</i>
13.00-14.30	Обед
Применение микроскопии в биологии и медицине, КРИО-ЭМ	
14.30-14.45	«Трехмерная организация эукариотических полирибосом: крио-ЭТ анализ» <i>Афоница Ж.А.</i>
14.45-15.00	«Применение методов электронной 2D кристаллографии для изучения структуры комплексов белка DPS с ДНК» <i>Моисеенко А.В.</i>
15.00-15.15	«Пространственная структура цитохром с нитритредуктазы из бактерии <i>Thioalkalivibrio nitratireducens</i> , полученная методом крио-электронной микроскопии» <i>Баймухаметов Т.Н.</i>
15.15-15.30	«Структура шаперонина бактериофага ОВР по данным крио-электронной микроскопии» <i>Станишнева-Коновалова Т.Б.</i>
15.30-15.45	«Криоэлектронная микроскопия 70S рибосомных комплексов с антибиотиками» <i>Пичкур Е.Б.</i>
15.45-16.00	«АСМ исследование влияния температуры на пленки дипептидов из различных сред» <i>Сафиуллина А.С.</i>
16.00-16.30	Кофе-брейк

27 августа Школа молодых ученых



Методы электронной микроскопии и микроанализа в исследовании предметов культурного наследия	
16.30-16.45	«Исследование объектов культурного наследия комплексными методами электронной микроскопии» <i>Колобылина Н.Н.</i>
Микроскопия и сопряженные методы в материаловедении	
16.45-17.00	«Структурная характеристика симплексных мембран на основе полиэлектролитных комплексов хитозана» <i>Орехов А.С.</i>
17.00-17.15	«Микроструктурный анализ сверхпроводящих лент второго поколения на основе (Gd)BCO с искусственными центрами пиннинга BaSnO ₃ и BaZrO ₃ » <i>Овчаров А.В.</i>
17.15-17.30	«Криогенная сканирующая электронная микроскопия в исследованиях биосовместимых контейнеров для адресной доставки лекарств» <i>Камышинский Р.А.</i>
17.30-17.45	«Особенности нанокристаллизации аморфного сплава Al ₉₀ Y ₁₀ при деформации и термообработке» <i>Першина Е.А.</i>
17.45-18.00	«Формирование и исследование хиральных фотонных нано-структур методами растровой электронной микроскопии» <i>Рогов О.Ю.</i>
18.00-18.15	«Определение типа LPSO-фаз в магниевом сплаве системы Mg-Zn-Y методами электронной дифракции и высокого разрешения (HRTEM)» <i>Защипин А.В.</i>
18.15	Заккрытие школы
19.00	Welcome party

28 августа Конференция

09.00	Открытие конференции
09.00-09.10	Вступительное слово, <i>Ковальчук М.В.</i>
09.10-09.20	Приветственное слово, <i>Рощупкин Д.В.</i>
09.20-09.25	Памяти Киселева Н.А., <i>Васильев А.Л.</i>
	Приглашенные доклады
09.30-10.00	«Кинетика атомных перестроек на примере графена» <i>Чувилин А.Л.</i>
10.00-10.30	«Applications of electron microscopy for metal additive manufacturing» <i>Эйндоу М.</i>
10.30-11.00	«Study of the order of the domains in the matrix of the Al-Co-Cr-Fe-Ni high entropy alloy» <i>Меши Л.</i>
11.00-11.30	«Просвечивающая электронная микроскопия сомкнутых нанопроволок GaN» <i>Боргардт Н.И.</i>
11.30-12.00	«Определение кристаллической структуры новых фаз методами высоко-разрешающей ЭМ» <i>Васильев А.Л.</i>
12.00-12.20	Кофе-брейк
	Новые методы просвечивающей/растровой электронной микроскопии, электронной дифракции и микроанализа. Новые приборы, элементы электронной оптики, детекторы и обработка изображений Председатели сессии: Лебедев О.И., Якимов Е.Б.
12.20-12.35	«Трёхмерная электронная микроскопия в исследовании наноматериалов» <i>Модин Е.Б.</i>
12.35-12.55	«Лоренцева микроскопия наноразмерных цилиндрических магнитных доменов» <i>Гусев С.А.</i>
12.55-13.15	«Двухпотоковая модель транспорта пучка электронов РЭМ в веществе при многократном рассеянии: применение в задачах рентгеноспектрального микроанализа» <i>Михеев Н.Н.</i>
13.15-13.35	«К решению обратной задачи электронно-микроскопической томографии. Итеративные алгоритмы на примере кристалла с точечным дефектом кулоновского типа» <i>Чуховский Ф.Н.</i>
13.35-14.05	Сообщение представителей компании «Thermo Fisher Scientific» «Latest developments in corrected TEM: low kV A5-free imaging, iDPC-STEM and EMPAD» <i>Anil O. Yalcin</i>
14.05-15.00	Обед
	Приглашенные доклады
15.00-15.30	«Моделирование и электронно-микроскопическое наблюдение нано-дефектов в материалах для термоядерных реакторов» <i>Дударев С.Л.</i>
15.30-16.00	«Структурные исследования металлосодержащих наночастиц методами электронной кристаллографии» <i>Авилев А.С.</i>

28 августа Конференция



	Электронная микроскопия, электронная дифракция и микроанализ в исследовании новых материалов Председатели сессии: Боргардт Н.И., Соколова О.С.
16.00-16.20	«Электронная микроскопия границ раздела тонких пленок ЦТС/ЛБС» <i>Жигалина О.М.</i>
16.20-16.40	«Выявление мезопор в цеолите методами электронной микроскопии и фокусированного ионного пучка» <i>Кукин В.Н.</i>
16.40-17.10	Сообщение представителей компании «Gatan» «Advantages of Direct Detection and Electron Counting for Electron Energy Loss Spectroscopy Data Acquisition» <i>Paolo Longo</i>
17.10-17.30	Кофе-брейк
	Другие применения электронной микроскопии и комплементарных методов Председатели сессии: Боргардт Н.И., Соколова О.С.
17.30-17.45	«Анализ тонких сегнетоэлектрических плёнок на основе $\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{O}_2$ методами просвечивающей электронной микроскопии» <i>Зарубин С.С.</i>
17.45-18.00	«Влияние высокоэнергетичного тяжелоионного облучения на наномасштабное состояние перспективных титановых сплавов и дисперсно-упрочненной оксидами стали» <i>Богачев А.А.</i>
18.00-18.15	«Микроструктурный анализ сверхпроводящей ленты на основе YBCO после радиационного облучения ионами ^{131}Xe с различными энергиями» <i>Овчаров А.В.</i>
18.15-18.25	Сообщение представителей компании «Tescan» «Возможности сканирующих электронных микроскопов TESCAN при исследовании конструкционных и функциональных материалов» <i>Миловзоров Н.Г.</i>
18.25-18.35	Сообщение представителей компании «Мелитек» «Современные настольные сканирующие электронные микроскопы компании «Phenom-World BV» (Нидерланды) – системы получения изображений и анализа»
10.00-20.00	Стендовая сессия (по секциям): 2. Крио-ЭМ и применение электронной, конфокальной сканирующей микроскопии в биологии и медицине. 4. Растровая электронная и ионная микроскопия. In-situ исследования в РЭМ

29 августа Конференция

Приглашенные доклады	
09.00-09.30	«Profile Imaging: 35 years old and still tracking» <i>Маркс Л.Д.</i>
09.30-10.00	«Ultrafast electron diffraction and electron microscopy: Present status and future prospects» <i>Ищенко А.А.</i>
10.00-10.30	«Mapping Atomic Motions with Ultrabright Electrons: Realization of the Chemists' Gedanken Experiment» <i>Миллер Р. Дж. Двейн</i>
10.30-10.50	«Сверхбыстрая электронная дифракция и динамическая просвечивающая электронная микроскопия в Институте спектроскопии РАН» <i>Рябов Е.А.</i>
10.50-11.20	«State of the art tem precession diffraction techniques: From 3d diffraction tomography to orientation imaging» <i>Николопулос С.</i>
11.20-11.50	Сообщение представителей компании «Thermo Fisher Scientific» «Advanced solutions for SEM and DualBeam automation» <i>Anna Prokhodtseva</i>
11.50-12.10	Кофе-брейк
Электронная микроскопия в химии, геологии и метеоритоведении Председатели сессии: Авиллов А.С., Чувиллин А.Л.	
12.10-12.30	«Возможности электронной микроскопии в изучении лунного грунта» <i>Мохов А.В.</i>
12.30-12.45	«Диагностика и изучение природных высокотемпературных стёкол методами электронной микроскопии» <i>Горностаева Т.А.</i>
12.45-13.00	«О роли современных методов электронной и микрозондовой микроскопии в изучении техногенных отложений Мутновского геотермального комплекса (Южная Камчатка)» <i>Округин В.М.</i>
Приглашенный доклад	
13.00-13.30	«Исследование дефектов упаковки в 4H-SiC методами РЭМ» <i>Якимов Е.Б.</i>
Растровая электронная и ионная микроскопия. In-situ исследования в РЭМ Председатели сессии: Авиллов А.С., Чувиллин А.Л.	
13.30-13.45	«Исследование влияния облучения электронным пучком в РЭМ на дислокации, введенные при инденитировании GaN» <i>Вергелес П.С.</i>
13.45-14.00	«Металлические нано-провода различных типов: электронная микроскопия с элементным анализом» <i>Загорский Д.Л.</i>
14.00-14.15	«Исследование морфологии поверхности и эффективности гетеропереходных фотоэлектрических преобразователей на основе квазимоноткристаллических кремниевых пластин» <i>Вербицкий В.Н.</i>
14.15-14.30	Сообщение представителей компании «Tescan» «Травление сфокусированным и расфокусированным ионным пучком как пробоподготовка для микро-текстурного анализа EBSD» <i>Лукашова М.В.</i>

29 августа Конференция



14.30-15.30	Обед
КРИО-ЭМ и применение электронной, конфокальной сканирующей микроскопии в биологии и медицине Председатели сессии: Соколова О.С., Орлова Е.	
15.30-15.45	«Ультраструктура жгутиков Helicobacter pylori» <i>Жуховицкий В.Г.</i>
15.45-16.00	«Особенности компактизации хроматина в хромосомах растений с гигантским геномом» <i>Шеваль Е.В.</i>
16.00-16.15	«Визуализация комплекса аденовирусной ДНК (OА7) с концевыми белками» <i>Лисицын Ф.В.</i>
16.15-16.30	«Структурные преобразования мезенхимальных стволовых клеток при контакте с биоактивными покрытиями на имплантатах» <i>Плехова Н.Г.</i>
16.30-16.45	«Ультраструктура внутриклеточных органелл при апоптозе» <i>Снигиревская Е.С.</i>
16.45-17.00	«Новый механизм формирования амилоидных фибрилл» <i>Селиванова О.М.</i>
17.00-17.10	Сообщение представителей компании «Sernia» «Аналитическое и технологическое оборудование» <i>Корнев П.А.</i>
17.10-17.30	Кофе-брейк
17.30-17.45	«Маркеры нарушения функции нервной системы у пациентов с болезнью Альцгеймера и прионными заболеваниями: ультраструктурные и наноскопические исследования» <i>Асташонок А.Н.</i>
17.45-18.00	«Трёхмерная организация ядрышкового домена в пространстве соматического ядра инфузории Didinium nasutum и локализация ключевых ядрышковых белков в нём» <i>Попенко В.И.</i>
18.00-18.15	«Особенности ультраструктуры митохондриального аппарата скелетной мышцы голого землекопа (Heterocephalus glaber)» <i>Бакеева Л.Е.</i>
18.15-18.30	«Особенности ультраструктуры покровов криобиотической пиявки Ozobranchus jantseanus. (Annelida; Hirudinea; Rhynchobdellida)» <i>Евтюгин В.Г.</i>
19.30-21.30	Фуршет
09.00-19.30	Стендовая сессия (по секциям): <ol style="list-style-type: none"> 1. Новые методы просвечивающей/растровой электронной микроскопии, электронной дифракции и микроанализа. Новые приборы, элементы электронной оптики, детекторы и обработка изображений. 5. Методы электронной микроскопии и микроанализа в исследовании предметов культурного наследия. 6. Сканирующая зондовая микроскопия. 8. Электронная и ионная литография. Микроскопия в современных технологиях. 9. Электронная микроскопия в химии, геологии и метеоритоведении. 10. Другие применения электронной микроскопии и комплементарных методов.

30 августа Конференция



Приглашенный доклад	
09.00-09.20	«First woven covalent organic framework solved using electron crystallography» <i>Олейников П.Н.</i>
09.20-09.50	Сообщение представителей компании «Oxford Instruments» «Применение новых ЭДС и EBSD детекторов компании Oxford Instruments в исследованиях наноструктурированных материалов» <i>Козлов В.В.</i>
Сканирующая зондовая микроскопия Председатели сессии: Кукин В.Н., Жигалина О.М.	
09.50-10.15	«Совместное использование методов сканирующей силовой микроскопии для определения электрофизических параметров индивидуальных многостенных углеродных нанотрубок» <i>Соколов Д.В.</i>
10.15-10.30	«Изучение морфологии поверхности жидкокристаллического сополимера при фазовых переходах методом АСМ» <i>Синицына О.В.</i>
10.30-10.40	Сообщение представителей компании «Conetech» «Новые возможности атомно-силовой микроскопии от Nanosurf» <i>Шуравин А.А.</i>
Электронная и ионная литография. Микроскопия в современных технологиях Председатели сессии: Кукин В.Н., Жигалина О.М.	
10.40-10.55	«Оптимизация электронно-оптических систем электронно-лучевых литографов и растровых электронных микроскопов» <i>Казмирук В.В.</i>
10.55-11.10	«Литография сфокусированным ионным пучком с использованием усиленного травления неорганических тонких пленок» <i>Петров Ю.В.</i>
Методы электронной микроскопии и микроанализа в исследовании предметов культурного наследия Председатели сессии: Кукин В.Н., Жигалина О.М.	
11.10-11.25	«Средневековые письменные источники: комплексные исследования с использованием растровой электронной микроскопии, микроанализа и других комплементарных методов» <i>Созонтов Е.А.</i>
11.25-11.40	«Применение электронной микроскопии при исследовании произведений искусства» <i>Кадикова И.Ф.</i>
11.40-11.50	Сообщение представителей компании «Tescan» «Наблюдение пор нанометрового размера в диэлектриках средствами сканирующей электронной микроскопии» <i>Сомов П.А.</i>
11.50-12.00	Сообщение представителей компании «Tescan» «Автоматизированный минералогический анализ многокомпонентных образцов, содержащих составляющие близкого состава. Различение гематита и магнетита» <i>Сорокопудова Ю.В.</i>

30 августа Конференция



12.00-12.15	Сообщение представителей компании «Technoinfo» «Цифровой анализ пород как комплексный метод изучения керамики и иных образцов культурного наследия» <i>Корнейчик О.Е.</i>
12.15	Заккрытие конференции
12.15-12.30	Завершающее слово. Подведение итогов. <i>Авилов А.С.</i>
14.30	Экскурсия и фуршет на корабле
09.00-12.30	Стендовая сессия (по секциям): 3. Электронная микроскопия, электронная дифракция и микроанализ в исследовании новых материалов.

Научная программа стендовых докладов
XXVII-ой Российской конференции по электронной микроскопии

Название секции. 1. Новые методы просвечивающей/растровой электронной микроскопии, электронной дифракции и микроанализа. Новые приборы, элементы электронной оптики, детекторы и обработка изображений.

ФИО докладчика	Название доклада
<u>Алексеева Е.В.</u> , Кулешова Е.А., Фролов А.С., Сафонов Д.В.	<i>Разработка и применение программного модуля для определения ориентации кристаллитов в ГПУ-материалах</i>
Амрастанов А.Н., Серегина Е.В., <u>Степович М.А.</u>	<i>Оценка нагрева поверхности однородной металлической мишени электронным зондом</i>
<u>Васильева А.В.</u> , Дарзбек С.А., Желкобаев Ж.Е., Фурдилова М.А., Царбаев Р.Х.	<i>Использование методов и средств лазерной нанометрии в прикладных технологиях: неразрушающий контроль и техническая диагностика (НКТД)</i>
Васин О.И., Правдюк В.П., Кулаков А.А.	<i>Новый подход к вопросу о нормировке интенсивности рассеяния электронов на аморфных образцах</i>
Гелевер В.Д.	<i>Возможности режима прошедшего рентгена в РЭМ для исследования тонких объектов</i>
Глухов В.С.	<i>Использование преобразования Фурье при анализе изображений доменной структуры кристаллов семейства триглицинсульфата</i>
Горбачев И.А., Смирнов А.В., Аткин В.С., Глуховской Е.Г., Вениг С.Б	<i>Применение просвечивающей электронной микроскопии для оценки типа и качества упаковки квантовые точек в Ленгмюровских монослоях на твердых подложках</i>
Заводов А.В., <u>Зайцев Д.В.</u> , Светлов И.Л., Кузьмина Н.А.	<i>Определение ОС и плоскостей сопряжения γ-силицидов с матрицей на основе твердого раствора Nb методами просвечивающей электронной микроскопии</i>
Зарубин А.Н., Колесникова И.И., Лозинская А.Д., Михайлов Т.А., Новиков В.А., Толбанов О.П., Тяжев А.В., Шемерянкина А.В., Щербаков И.Д., Щербаков П.С.	<i>Арсенид галлиевые матричные сенсоры для электронной микроскопии</i>
Казмирук В.В., Курганов И.Г., Подкопаев А.А., Савицкая Т.Н.	<i>Анализ характеристик тракта регистрации сигналов РЭМ по видеоизображениям</i>
Казмирук В.В., Курганов И.Г., Подкопаев А.А., Савицкая Т.Н.	<i>Расчет электронно-оптической системы РЭМ с LaB₆ катодом</i>
<u>Крисько О.В.</u> , Скоробогатова Т.В.	<i>Температурная зависимость теплового структурного фактора металлов в модели гладкого нелокального модельного потенциала</i>
<u>Кульгин А.К.</u> , Авилов А.С., Новикова В., Кульгин К.В., Лепешов Г.Г.	<i>Новые подходы к прецизионным измерениям электронограмм</i>
Курганов И.Г.	<i>Моделирование электростатической объективной линзы растрового электронного микроскопа</i>

Кязумов М.Г., Рустамова Л.В.	<i>Дифракция электронов от нанопленок, искривленных вокруг случайных осей</i>
Ларионов Ю.В.	<i>Влияние контаминации на параметры выступа в высоковольтном РЭМ</i>
Ларионов Ю.В., Озерин Ю.В.	<i>Осаждение контаминационной пленки на выступ в низковольтном РЭМ</i>
<u>Сокура Л.А.</u> , Неведомский В.Н., Берг Н.А.	<i>Особенности формирования муара на электронно-микроскопических изображениях квантовых точек, содержащих дислокации</i>
<u>Суродин С.И.</u> , Шоболов Е.Л., Николичев Д.Е.	<i>Подготовка поперечных сколов для РЭМ методом трехлучевой ионной резки</i>
Шкорняков С.М.	<i>Аналитическое выражение для описания осцилляций интенсивности зеркального рефлекса от поверхности растущей гетероэпитаксиальной пленки</i>

Название секции. 2. Крио-ЭМ и применение электронной, конфокальной сканирующей микроскопии в биологии и медицине.

ФИО докладчика	Название доклада
<u>Daminova A.G.</u> , Gorshkov V.Y., Ageeva M.V., Petrova O.E., Mikshina P.V., Gogolev Y.V.	<i>Colonization strategy of Solanaceae plants by the phytopathogen Pectobacterium atrosepticum SCRI1043</i>
Hovnanyan K., Navasardyan L., Marutyun S., Hovnanyan M., Gasparyan H., Trchounian A.	<i>Ultrastructural analysis of yeast Candida guilliermondii VP-4 during cultivation at nitrogen deficiency</i>
Marin E., Luginina A., Gusach A., Mishin A., Kovalev K., Borshchevskiy V., Cherezov V.	<i>MEMBRANE PROTEIN STRUCTURE DETERMINATION from twinned data USING X-RAY FREE ELECTRON LASER</i>
Алехова Т.А., Васильев А.Л., Загустина Н.А., Новожилова Т.Ю., Чвалун Н.С.	<i>Биокоррозионные повреждения конструкционных алюминий-магниевого сплавов, исследования методами РЭМ с помощью ППК</i>
Андреевская С.Г., <u>Шевлягина Н.В.</u> , Псеунова Д.Р.	<i>Сканирующая электронная микроскопия клинических изолятов Staphylococcus aureus после воздействия антибактериальных препаратов разных групп</i>
Ахатов Е.А., Манькин А.А.	<i>Электронная микроскопия как инструмент экспресс диагностики вирусных заболеваний сельскохозяйственных растений</i>
Бабоша А.В., Лошакова П.О., Упельник В.П.	<i>Микроморфологические особенности поверхности листьев некоторых видов рода Elitrigia (Poaceae)</i>
Байбеков И.М., Бутаев А.Х.	<i>Низкоинтенсивное лазерное излучение не индуцирует опухолевый рост (Электронномикроскопические исследования)</i>
Байбеков И.М., Ирханов М.М., Аббасова М.Г.	<i>Ультраструктура слизистой оболочки полости рта при протезных стоматитах и лазерных воздействиях</i>
<u>Баймухаметов Т.Н.</u> , Чесноков Ю.М., Афонина Ж.А., Мясников А.Г., Васильев А.Л.	<i>Исследование пространственной организации макромолекулярных комплексов методами крио-электронной томографии</i>
Боков А.В., Лямкин П.В.,	<i>Исследование цианобактерии Arthrospira platensis</i>

Коннычев М.А., Рогожкин С.В., Степанов С.В., Столбунов В.С.	<i>методом атомно-силовой микроскопии</i>
Бугрова М.Л., Галкина М.В., Яковлева Е.И.	<i>Применение иммуноцитохимии «post-embedding» в исследовании натрийуретических пептидов</i>
Бутаев А.Х., Мардонов Д.Н.	<i>Электронная микроскопия взаимодействия шовного материала с тканями кожных ран под влиянием лазерного и светодиодного излучения</i>
Геворкян М.М., Бабоша А.В., Лошакова П.О., Упелниек В.П.	<i>Особенности анатомической структуры листовых пластинок пшениц, полученных в результате межвидовых скрещиваний</i>
Грефнер Н.М., Громова Л.В., Комиссарчик Я.Ю.	<i>Иммуноцитохимическое исследование распределения транспортеров глюкозы SGLT1 и GLUT2 в энтероцитах с применением электронной и конфокальной микроскопии</i>
Гущина Е.А., Лисицын Ф.В., Лопатина О.А., Суэтина И.А., Исаева Е.И., Ковалевский Ц.А., Буданов Б.А., Даличик Ф.А., Мезенцева М.А.	<i>Электронная микроскопия суспензии вируса гриппа A/Aichi/(H₃N₂) обработанных полиоксометаллатами различного состава (ПОМ)</i>
Дробышева И.М.	<i>Умножение центриолей в клетках мерцательного эпителия у археофорных и неоофорных турбеллярий</i>
Евтюгин В.Г., Рогов А.М., Валеева Л.Р., Сальников В.В., Осин Ю.Н., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Степанов А.Л.	<i>Наноструктурированные подложки для подсчета бактерий, полученные методом ионной имплантации</i>
Жуйкова Ю.В., <u>Зубарева А.А.</u> , Варламов В.П.	<i>Создание тонких плёнок на основе хитозана для биомедицинского применения</i>
<u>Жуховицкий В.Г.</u> , Андреевская С.Г., Мругова Т.М., Качалова И.В.	<i>Применение сканирующей электронной микроскопии при микробиологической диагностике бактериемии</i>
<u>Зиновьев С.В.</u> , Плехова Н.Г., Радьков И.В.	<i>Электронно-микроскопическая характеристика диагностического значения флеботомии левой каудальной легочной вены белых крыс</i>
Зубашева М.В., Смирнова Т.А., Шевлягина Н.В., Жуховицкий В.Г.	<i>Изучение морфологии спор Brevibacillus laterosporus с помощью электронной микроскопии</i>
Иванова А.И., Курбатова Л.А.	<i>Электронно-микроскопический анализ кристалломорфологических картин в биологических жидкостях</i>
Казанцев А.В., Ерохин П.С., Уткин Д.В., Осина Н.А., Абдрашитова А.С.	<i>Оценка морфофункциональных свойств уропатогенных штаммов Escherichia coli методом атомно-силовой микроскопии</i>
Королев Ю.Н., Гениатулина М.С., Никулина Л.А.	<i>Ультроструктура адренокортикоцитов при профилактическом применении низкоинтенсивного электромагнитного излучения в условиях радиации</i>
Королев Ю.Н., Гениатулина М.С., Никулина Л.А.	<i>Ультроструктурные изменения в клетках Сертоли и сперматогониях при действии низкоинтенсивного электромагнитного излучения в условиях радиации</i>
Кузьмина Н.В.	<i>Амилоидные нанофибриллы</i>
Кумахова Т.Х.	<i>Особенности ультроструктуры хлоропластов в клетках перикарпия Malus Mill. (Rosaceae), произрастающих в горах</i>

Сульдина Л.А., Кизилова Е.А., Морозова К.Н., Киселева Е.В..	<i>Различие морфометрических параметров и ультраструктурной организации клеток химерных бластоцист, полученных методами инъекции или агрегации с эмбриональными стволовыми клетками</i>
Леонова О.Г., Караджян Б.П., Скарлато С.О., Попенко В.И.	<i>Трёхмерная организация ядрышкового домена в пространстве соматического ядра инфузории <i>Didinium nasutum</i> и локализация ключевых ядрышковых белков в нём</i>
Мазина С.Е., Шушпанова Д.В., Козлова Е.В., Боков А.В.	<i>Применение криофиксации для подготовки водорослей к исследованию методом сканирующей электронной микроскопии</i>
Манькин А.А., Лисицын Ф.В.	<i>Эжекция фаговой ДНК через отросток под действием формамида</i>
Мотылева С.М.	<i>Применение аналитического РЭМ для выявления кристаллоносных клеток в тканях растений и определения их элементного состава</i>
Неретина А.Н.	<i>Перспективы использования растровой электронной микроскопии в систематике тропических ветвистоусых ракообразных (Crustacea: Cladocera)</i>
Пичугова С.В., Тулакина Л.Г., Савинова Т.Л., Лебедева Л.М., Бейкин Я.Б.	<i>Ультраструктурные изменения плаценты при антеннальной гибели плода</i>
Плиева З.С., Смирнова Т.А., Андреевская С.Г., Жуховицкий В.Г.	<i>Электронно-микроскопическое изучение биоплёнок, образуемых <i>Bacillus cereus</i></i>
Плиева З.С., Смирнова Т.А., Андреевская С.Г., Шевлягина Н.В., Богданов И.А., Жуховицкий В.Г.	<i>Электронномикроскопическое изучение штаммов <i>Bacillus cereus</i> различного происхождения</i>
Плотников А.Д., Алехова Т.А., Корнеева Е.Ю., Новожилова Т.Ю., Загустина Н.А.	<i>Исследование биокоррозии образцов алюминий-магниевого сплава методами сканирующей лазерной микроскопии и рентгеновской томографии, влияние коррозии на прочностные характеристики сплавов АМг6 и 1570</i>
Рашковский А.Ю., Рыжов А.П., Дмитриева Т.Г.	<i>Исследование полимерных покрытий биodeградируемых стентов</i>
Семенова С.Б., Кевер Л.В., Комиссарчик Я.Ю.	<i>Ассоциация каналов TRPV6 с липидными рафтами в клетках <i>Jurkat</i></i>
Смирнова Е.А., Букаева И.А., Бежанова С.Д., Иванова Т.А.	<i>Ультраструктурная гетерогенность онкоцитом почек человека</i>
Солдатенко Е.В., Петров А.А.	<i>РЭМ и конфокальные исследования дистальных отделов половой системы пресноводных моллюсков</i>
Уткин Д.В., Булгакова Е.Г., Ерохин П.С., Кузнецов О.С., Куклев В.Е., Осина Н.А.	<i>Оценка влияния температуры на морфологию клеток бактерий <i>Yersinia pestis</i> методом атомно-силовой микроскопии</i>
Хацаева Р.М.	<i>Компенсаторные механизмы в слизистой оболочке полости рта у жвачных животных</i>
Хуторская И.А., Балашов В.П., Евтюгин В.Г., Шаймарданова Г.Ф., Абрамов В.Н., Герасимова Н.Г.	<i>Морфология скелетных мышц крыс при моделировании динамической физической нагрузки и действии L-карнитина</i>

Чабан Е.М., Солдатенко Е.В.	<i>РЭМ-морфология пениальной патиллы как важный диагностический признак в систематике заднежаберных моллюсков</i>
Чуфаров А.Ю., Григоров И.Г.	<i>Фрактальный анализ биокомпозита на основе высокопористого ячеистого материала</i>
Шаймарданова Г.Ф., Тяпкина О.В., Резвяков П.Н., Исламов Р.Р., Никольский Е.Е.	<i>Влияние длительного космического полета на состояние спинного мозга и седалищного нерва мышцы</i>
Шатров А.Б.	<i>Ультроструктура дермальных желез водяного клеща <i>Limnochares aquatica</i> (L., 1758) (Acariformes, Limnocharidae) и их функциональное значение</i>
Эльдаров Ч.М.	<i>Особенности структурной организации мышечных клеток червей-волосатиков <i>Gordionus alpestris</i></i>
Яценко А.А., Целуйко С.С., Устинов Е.М., Леонов Д.В., Кушнарев В.А.	<i>Растровая микроскопия децеллюризованного лёгкого крысы для использования в тканевой инженерии и культивировании клеток</i>

Название секции. 3. Электронная микроскопия, электронная дифракция и микроанализ в исследовании новых материалов.

ФИО докладчика	Название доклада
Rashkovets M.V., Nikulina A.A.	<i>Phase composition of heat-resistant nickel-base alloy in additive manufacturing</i>
Абрамова Е.Н., Артемов В.В., Хорт А.М., Яковенко А.Г., Слипченко Е.А.	<i>Исследования слоёв и наночастиц пористого кремния (por-Si) методом электронной микроскопии</i>
Абросимова Г.Е., Волков Н.А., Аронин А.С., Орлова Н.Н.	<i>Влияние Nb на кристаллизацию аморфного сплава системы Co-Fe-Si-B-Nb.</i>
Агарков Д.А., Борик М.А., Бублик В.Т., Бредихин С.И., Кулебякин А.В., Курицина И.Е., Ломонова Е.Е., Милович Ф.О., Мызина В.А., Осико В.В., Табачкова Н.Ю.	<i>Структура и транспортные свойства твердых растворов ZrO₂ легированных Sc₂O₃ и CeO₂</i>
Алекперов Э.Ш., Назаров А.М., Фарзалиев С.С.	<i>Кинетика кристаллизации получаемых в электрическом поле аморфных плёнок TlIn_{1-x}Sn_xS₂</i>
Аронин А.С., Аристова И.М., Васенев В.В., Мироненко В.Н.	<i>Нанопорошок в структуре алюмоматричного порошкового композита</i>
Афанасенкова Е.С., Жигач А.Н., Кусков М.Л., Лейпунский И.О., Березкина Н.Г., Сафронова О.А., Дудин А.А.	<i>Получение левитационно-струйным методом и исследование структуры нанопорошков карбида титана</i>
Афанасенкова Е.С., Жигач А.Н., Кусков М.Л., Лейпунский И.О., Березкина Н.Г., Сафронова О.А., Сиротина А.П., Белов В.С.	<i>Получение левитационно-струйным методом и исследование структуры нанопорошков "сплава" железо-медь</i>
Афанасенкова Е.С., Жигач А.Н., Кусков М.Л., Лейпунский И.О., Березкина Н.Г., Сафронова О.А.	<i>Исследование структуры нанопорошков системы Fe-C, получаемых левитационно-струйным методом</i>
Баран Л.В.	<i>Растровая электронная микроскопия композитных плёнок системы фуллерит-алюминий-олово</i>

<u>Баскаков Е.Б.</u> , Стрелов В.И., Михеев Н.Н., Волчков И.С.	<i>Исследование состава пленок SmS, полученных магнетронным распылением</i>
Берт Н.А., Неведомский В.Н., Чалдышев В.В., Cherkashin N.A., Преображенский В.В., Путято М.А., Семягин Б.Р.	<i>Состав и микроструктура металлических нановключений AsSb в LTG-AlGaAsSb</i>
Бойцова О.В., Леонтьев А.П., Игонина Е.Д., Елисеев А.А.	<i>Электронная микроскопия и электронная дифракция в изучении метастабильных состояний на примере органико-неорганических мезокристаллов</i>
Болотов В.В., Ивлев К.Е., Кан В.Е., <u>Князев Е.В.</u> , Поворознюк С.Н., Соколов Д.В.	<i>Модификация электрофизических свойств индивидуальных многостенных углеродных нанотрубок под воздействием ионного облучения и отжига в инертной среде</i>
Вирюс А.А., Коровушкин В.В., Шипко М.Н., Труханов А.В., <u>Степович М.А.</u> , Костишин В.Г., Миронович А.Ю.	<i>Особенности магнитной и кристаллической структуры гексагонального феррита $BaFe_{12-x}In_xO_{19}$</i>
<u>Волков Р.Л.</u> , Савчук Т.П., Гаврилин И.М., Дронов А.А., Боргардт Н.И., Гаврилов С.А.	<i>Исследование влияния условий термообработки на состав и структуру пористого анодного оксида титана методом просвечивающей электронной микроскопии</i>
<u>Герасимов Е.Ю.</u> , Исупова Л.А., Цыбуля С.В.	<i>Формирование микроструктурных особенностей перовскитоподобных оксидов в средах с низким парциальным давлением кислорода</i>
<u>Гнесин И.Б.</u> , Гнесин Б.А., Некрасов А.Н.	<i>Изучение удельной поверхности трещин в покрытиях на углерод-углеродных композитах</i>
Горбачев И.А., Смирнов А.В., Аткин В.С., Глуховской Е.Г., Вениг С.Б.	<i>Применение просвечивающей электронной микроскопии для оценки типа и качества упаковки квантовые точек в Ленгмюровских монослоях на твердых подложках</i>
Григорьев Ю.В., <u>Каримов Д.Н.</u> , Ивановская Н.А.	<i>Изучение нанокристаллов флюоритовой фазы SrF_{2+x}, полученных методом механохимического синтеза</i>
<u>Григорьев Ю.В.</u> , Сульянов С.Н., Синайский М.А., Пахило-Дарьял И.О., Литвинова И.С.	<i>Исследование частиц типа ядро-оболочка на основе оксидов Hf-Y-Al полученных плазмохимическим синтезом</i>
Донцов А.И., <u>Синецкая Д.А.</u> , Горбунов С.В.	<i>Электронно-микроскопическое исследование композитной мембраны с тонким селективным слоем основе твердых растворов Pd-Cu и Pd-Pb на поверхности двухслойной гетероструктуры с двухуровневой пористостью</i>
Елисеев А.А., Вербицкий Н.И., Вольхов А.А., Кумсков А.С., Басу В.Г., Васильев А.Л., Киселев Н.А.	<i>Кристаллография и электронное строение одномерных нанокристаллов в условиях пространственного ограничения</i>
<u>Жарков С.М.</u> , Алтунин Р.Р., Моисеенко Е.Т.	<i>Электроннографические in situ исследования структурных фазовых превращений при твердофазной реакции в двухслойной тонкопленочной наносистеме Al/Pt</i>

Жигалина О.М., Дегтярева А.Г., Хмеленин Д.Н., Симонов В.Н.	<i>Структура стали после обработки деформирующим резанием</i>
Жигалина О.М., Хмеленин Д.Н., Иванов И.М., Загорский Д.Л., Бедин С.А., Долуденко И.М.	<i>Электронная микроскопия нанопроволок Cu/Ni</i>
Зеер Г.М., Зеленкова Е.Г., Ледяева О.Н.	<i>Электроконтактный материал на основе Ag, дисперсно-упрочненный нанопорошками оксидов Zn, Sn и Ti</i>
Золоторевский Н.Ю., <u>Ушанова Э.А.</u> , Рыбин В.В.	<i>Исследование эволюции разориентировок границ деформационного происхождения методом EBSD-анализа</i>
<u>Зыбина Ю.С.</u> , Приходько А.С., Боргардт Н.И., Zallo E., Calarco R.	<i>Исследование атомарного строения этитаксиального слоя $Ge_3Sb_2Te_6$ методом высокоразрешающей электронной микроскопии</i>
<u>Ищенко А.В.</u> , Мосеенков С.И., Казакова М.А., Кузнецов В.Л.	<i>Исследование композитных материалов Fe,Co@УНТ методами ПЭМВР</i>
<u>Калита В.И.</u> , Чернов М.С., Соколов В.Н.	<i>Микроструктурные исследования плазменных покрытий гидроксиапатита на титановых подложках</i>
<u>Каратеев И.А.</u> , Овешников Л.Н., Селиванов Ю.Г., Чижевский Е.Г., Аронзон Б.А., Васильев А.Л.	<i>Характеризация Eu содержащих дефектов в матрице Bi_2Se_3</i>
<u>Касумов Ю.А.</u> , Волков В.Т., Касумов А.Ю., Ходос И.И.	<i>Структура нанопроволок Bi, полученных методом ВЧ-диодного распыления на различных подложках</i>
Кийко В.М., Колчин А.А., Милейко С.Т., Новохатская Н.И.	<i>Структура композитных волокон и пластин, полученных из оксидов алюминия и кальция</i>
Кийко В.М., Коржов В.П.	<i>Структура и разрушение слоистого Mo-Si-B композита</i>
Кириленко Д.А.	<i>Измерение спектра изгибных фононов свободного графена в области малых волновых векторов</i>
Колосов В.Ю., Веретенников Л.М., <u>Юшков А.А.</u> , Бокуняева А.О.	<i>Электронная микроскопия тонких плёнок висмута, полученных вакуумным напылением</i>
Колосов В.Ю., <u>Юшков А.А.</u> , Андреев С.В., Кудреватых Н.В.	<i>Электронная микроскопия структур, формируемых в быстрозакаленных магнитных сплавах состава SmZrFeTi</i>
Коржов В.П., Кийко В.М.	<i>Особенности структуры слоистого композита на основе ниобия</i>
<u>Коржов В.П.</u> , Кийко В.М., Желтякова И.С.	<i>Характеристики и особенности слоистой структуры жаропрочного композита на основе (Nb-Ti)-сплава</i>
Кравец В.А., Иванова Е.В., Яговкина М.А., Ситникова А.А., Седова И.В., Заморянская М.В.	<i>Деградация гетероструктур на основе соединений A2B6 при облучении электронным пучком средних энергий</i>

<u>Николичев Д.Е.</u> , Крюков Р.Н., Усов Ю.В., Павлов Д.А., Дорохин М.В., Звонков Б.Н., Зубков С.Ю.	<i>Состав и структура слоев GaMnAs, выращенных методом импульсного лазерного осаждения</i>
<u>Кузнецова Д.Е.</u> , Досовицкий Г.А., Волков П.А., Коржик М.В., Досовицкий А.Е., Бобкова Т.И., Михайлов М.С.	<i>Применение методов электронной микроскопии для решения технологических задач при получении порошков сложных оксидов со структурой граната</i>
Кузьмин А.В., Рашковский А.Ю., Каменев А.А.	<i>Анализ структуры дефектов слоев высокотемпературных сверхпроводящих лент 2-го поколения</i>
Кулешова Е.А., Фролов А.С., Мальцев Д.А., Кутузов Л.В., Алексеева Е.В., <u>Сафонов Д.В.</u> , Козлов И.В., Степанов Н.В.	<i>Исследование ориентации зерен в сплаве циркония Э110 в условиях облучения и испытаний на ползучесть</i>
Кулинич В.И., Бубликов Е.И., Коломиец В.В., Лялько Е.С., Чертова И.А.	<i>Применение методов ПЭМ при формировании сегментированных магнитных наноструктур</i>
Кумсков А.С., Закалюкин Р.М., Левкевич Е.А., Орехов А.С.	<i>Нанокопозиты внедрения в ОСУНТ на основе ионных проводников</i>
Кущев С.Б., Рябцев С.В., Солдатенко С.А., <u>Синельников А.А.</u>	<i>Электронно-микроскопическое исследование структуры и субструктуры оксидированных пленок Pd-Ru</i>
<u>Макарова И.П.</u> , Селезнева Е.В., Коморников В.А., Васильев А.Л.	<i>Структурные особенности кристаллов гидросульфат-фосфатов цезия и их влияние на физические свойства</i>
Маньшина А.А., Поволоцкая А.В., <u>Петров Ю.В.</u> , Данилов Д.В.	<i>Гибридные Au-Ag/C наноструктуры с управляемой морфологией, полученные в результате лазерно-индуцированного осаждения</i>
Милейко С.Т., Кийко В.М.	<i>Характеристики разрушения композита с хрупкой молибденовой матрицей и волокнами на основе сапфира и гексаалюмината кальция</i>
<u>Михайловский В.Ю.</u> , Данилов Д.В., Болтынюк Е.В., Убийвовк Е.В.	<i>Приготовление ламелей из металлических стекол методом сфокусированного ионного пучка</i>
Муравьева Т.И., Щербакова О.О., Загорский Д.Л.	<i>Исследование протекторных резин методом электронной микроскопии</i>
Муслимов А.Э., <u>Буташин А.В.</u> , Кольмагин А.Б., Каневский В.М.	<i>Комплексная микроскопия пленок AlN, полученных твердофазной эпитаксией на поверхности сапфира</i>
Николайчик В.И., Рошупкин Д.В., <u>Ковальчук М.Н.</u>	<i>Электронно-микроскопическое исследование кристаллов семейства лантан-галлиевого силиката $La_3Ga_5SiO_{14}$ и $Ca_3TaGa_3Si_2O_{14}$</i>
Новикова В.В.	<i>Об особенностях электронного строения фторидов некоторых щелочноземельных и редкоземельных элементов</i>
Ноженков М.В., Авилов А.С., Лобанова Е.С.	<i>Сверхнизкое трение легированных композиционных покрытий</i>

<u>Нуриев И.Р.</u> , Назаров А.М., Мехрабова М.А., Садыгов Р.М., Абдуллаева А.А., Мирзоев Э.И.	<i>Особенности роста и морфология поверхности эпитаксиальных пленок $Cd_{1-x}Fe_xTe$</i>
Парфёнов Н.М., <u>Годовицын И.В.</u>	<i>Исследование морфологии поверхности мембраны высокотемпературного преобразователя давления</i>
<u>Попов В.А.</u> , Вершинина Е.В., Ковальчук М.Н.	<i>Применение просвечивающей электронной микроскопии для идентификации неагломерированных наноалмазных частиц в медных композиционных материалах</i>
<u>Привезенцев В.В.</u> , Палагушкин А.Н., Скуратов В.А., Куликаускас В.С., Букунов К.А., Бурмистров А.В., Зилова О.С., Штейнман Э.А., Терещенко А.Н.	<i>Исследование пленки диоксида кремния, имплантированной Zn и облученной быстрыми ионами Хе</i>
<u>Приходько А.С.</u> , Боргардт Н.И., Neilmann M., Lopes J-M. J.	<i>Исследование эпитаксиальных слоев многослойного графена и гексагонального нитрида бора методом высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии</i>
Пустовалов Е.В., Модин Е.Б., Федорец А.Н., Ткачев В.В., Грабчиков С.С., Плотников В.С.	<i>Дифракционные методы исследования атомной структуры аморфных металлических сплавов в процессах релаксации и кристаллизации</i>
Рабаданов М.Р., Шапиев И.М., Исмаилов А.М.	<i>Морфология нитевидных кристаллов теллура</i>
Рашковский А.Ю., Дмитриева Т.Г., Радугин А.В., <u>Крупатин И.Н.</u> , Рыжов А.П.	<i>Электронная нанотомография в анализе объемной структуры композиционных материалов на основе ПММА и углеродных волокон с нанотрубками</i>
Садовская Н.В., Хатипов С.А., Кондратенко М.С., Архипов М.А., Бузник В.М.	<i>Применение методов РЭМ, ДСК, РСМА для исследования структуры гомо- и сополимеров тетрафторэтилена, обработанных в сверхкритическом диоксиде углерода и перфтороктане</i>
<u>Седловец Д.М.</u> , Корепанов В.И., Ходос И.И.	<i>Структура полифталоцианинов железа, кобальта, никеля и хрома</i>
Соколов В.Н., Разгулина О.В., Чернов М.С., <u>Комлев Д.И.</u>	<i>Пористые композиционные покрытия на титановых имплантатах</i>
<u>Сорокин Н.И.</u> , Васильев А.Л., Соболев Б.П.	ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУПЕРИОННОГО ПРОВОДНИКА $Sr_{0.65}La_{0.35}F_{2.35}$ СО СТРУКТУРОЙ ФЛЮОРИТА
<u>Сухинина Н.С.</u> , Ходос И.И., Жохов А.А., Масалов В.М., Зверькова И.И., Хасанов С.С., Емельченко Г.А.	<i>Синтез и структура нанокристаллов кубического углерода C_8</i>
Томаев В.В., Полищук В.А., Пшелко Н.С., Васильев Е.А.	<i>Сканирующая электронная микроскопия и оптические свойства в нанопористом оксиде алюминия</i>

Томаев В.В., Полищук В.А., Леонов Н.Б., Васильев Е.А.	<i>Сканирующая электронная микроскопия и плазмонный резонанс в наночастицах цинка</i>
<u>Трунькин И.Н.</u> , Васильев А.Л., Галиев Г.Б., Климов Е.А., Клочков А.Н., Пушкарев С.С.	<i>Исследование низкотемпературных структур LT-GaAs и LT-InGaAs методами электронной микроскопии</i>
<u>Трунькин И.Н.</u> , Васильев А.Л., Зверев А.А., Казаков И.П., Лихачев И.А., Пашаев Э.М., Пруцков Г.В., Субботин И.А., Цехош В.И.	<i>Исследование гетероструктур GaAs/In(As, Bi) методами электронной микроскопии.</i>
<u>Чапланов А.М.</u> , Маркевич М.И., Соловьев Я.А., Сарычев О.Э., Кушев С.Б., Сербин О.В.	<i>Фазовые превращения в системе Ni/Pt/Si при БТО</i>
Чесноков Ю.М., Мяконьких А.В., Рогожин А.Е., Руденко К.В., Васильев А.Л.	<i>Исследование микроструктуры тонких пленок HfO₂, выращенных методом плазменно стимулированного атомно-слоевого осаждения</i>
<u>Чиж К.В.</u> , Арапкина Л.В., Дубков В.П., Миронов С.А., Уваров О.В., Ставровский Д.Б., Наливайко О.Ю., Новиков А.Г., Гайдук П.И., Юрьев В.А.	<i>Рост пленок Si на диэлектрическом слое SiO₂/Si₃N₄ и образование силицидов Pt на поли-Si при низких температурах подложки</i>
Шапенков С.В., Вывенко О.Ф., Медведев О.С., Убийвовк Е.В., Seibt M., Saring P.	<i>Структура ядер α-винтовых дислокаций в n-GaN, введенных наноидентификацией</i>
Шемченко Е.И., Глазунова В.И.	<i>Особенности наноструктуры плёнок нитрида углерода, легированных оксидом европия в процессе роста</i>
<u>Шмытько И.М.</u> , Фролов Д.Д., Аронин А.С., Кедров В.В.	<i>Образование новых структурных состояний в прессованных нанопорошках BaTiO₃</i>
<u>Щербакова О.О.</u> , Муравьева Т.И., Загорский Д.Л.	<i>Электронная микроскопия в исследовании новых антифрикционных алюминиевых сплавов</i>

Название секции. 4. Растровая электронная и ионная микроскопии. In-situ исследования в РЭМ.

ФИО докладчика	Название доклада
<u>Uvarov O.</u> , Kalinushkin V., Gladilin A., Novikov G.	<i>Application of two-photon confocal microscopy for fluorescent tomography of semiconductor materials</i>
Анашкина Н.Е., <u>Бунин И.Ж.</u> , Копорулина Е.В.	<i>Изучение механизма импульсных энергетических воздействий на природные технические алмазы (РЭМ-РСМА, АСМ и ИКФС)</i>
<u>Аникьева А.Э.</u> , Петров Ю.В., Вывенко О.Ф.	<i>Вторичная электронная эмиссия из диэлектрических пленок нитрида и диоксида кремния в сканирующем гелиевом ионном микроскопе</i>
Антонова Н.М., <u>Андреев Е.В.</u>	<i>Морфология пористых композитов, полученных из суспензий натрий-карбоксиметилцеллюлозы с наночастицами AlOOH</i>

Антонович А.Н., Петрушин А.А.	<i>Исследование механизмов проводимости наноструктур на основе $PbZr_{0,52}Ti_{0,48}O_3$ методом наведенного тока</i>
Аткин В.С., Смирнов А.В., Горбачев И.А., Бессуднова Н.О., Вениг С.Б.	<i>Исследование самообразующихся кристаллических структур на поверхности дентина методами растровой электронной микроскопии</i>
<u>Бешенков В.Г.</u> , Знаменский А.Г., Марченко В.А., Некрасов А.Н.	<i>Диагностика элементного состава пленок ЦТС на платине методом РСМА</i>
<u>Волчков И.С.</u> , Ополченцев А.М., Каневский В.М.	<i>РЭМ и АСМ, как методы исследования влияния импульсного магнитного поля на состояние поверхности кристаллов CdTe</i>
Гасенкова И.В., <u>Андрухович И.М.</u> , Ткачев В.В.	<i>Методы растровой электронной микроскопии с микроанализом для исследования электрохимического осаждения никеля через слой пористого анодного оксида алюминия</i>
Гелевер В.Д.	<i>Возможности режима прошедшего рентгена в РЭМ для исследования тонких объектов</i>
<u>Гнесин И.Б.</u> , <u>Гнесин Б.А.</u> , Некрасов А.Н., Желтякова И.С.	<i>О взаимодействии кермета на основе TiC с расплавом Mo_3Si</i>
Горбунов Д.С., Нищев К.Н., Мишкин В.П., Лютова Е.Н., Долганов А.В.	<i>Применение РЭМ и СЗМ для исследования особенностей процессов анодирования алюминия</i>
<u>Гребеньщиков А.С.</u> , Волков А.В., Ледер М.О.	<i>Влияние параметров постобработки и шага съёмки на результаты обработки карт EBSD</i>
Григоренко В.Б.	<i>Применение растровой электронной микроскопии для изучения поврежденных жаропрочных никелевых сплавов</i>
Князев М.А., Митина А.А., Редькин А.Н., Золотарёва Н.И., Шилкина Н.Н., Гражулене С.С.	<i>Исследование структуры магниточувствительных композитов УНТ/Fe_3O_4 методами сканирующей электронной микроскопии</i>
<u>Крюков Р.Н.</u> , Николичев Д.Е., Боряков А.В., Данилов Ю.А., Лесников В.П., Зубков С.Ю.	<i>Физико-химические свойства слоёв разбавленных магнитных полупроводников, выращенных методом импульсного лазерного осаждения</i>
<u>Мальшкина О.В.</u> , Иванова А.И., Мальшкин Ю.А., Фоломеева А.С.	<i>Выявление неоднородности структуры монокристаллов твердых растворов CSBN методом РЭМ</i>
Маслов В.Г., <u>Митюхляев В.Б.</u> , Филиппов М.Н.	<i>Трёхмерная реконструкция элементов микро- и нанорельефа в РЭМ</i>
Новиков Ю.А.	<i>Влияние наклона электронного зонда на калибровку РЭМ</i>
Новиков Ю.А.	<i>Особенности формирования изображений трапецевидных структур с большими углами наклона боковых стенок в РЭМ в режиме сбора вторичных медленных электронов</i>
Ополченцев А.М., Волчков И.С., Кольмагин А.Б., Задорожная Л.А., Каневский В.М.	<i>Влияние обработки слабыми магнитными полями на морфологию наноструктур оксида цинка</i>
Орлов В.И., Солтанович О.А., Ярыкин Н.А., Якимов Е.Б.	<i>Влияние никеля на рекомбинационные свойства протяженных дефектов в кремнии</i>

Попов В.А.	<i>Применение сканирующей электронной микроскопии для изучения структуры металломатричных композитов с неагломерированными наноалмазными упрочняющими частицами</i>
<u>Попов В.А.</u> , Просвиряков А.С., Ковальчук М.Н.	<i>Исследование структуры гранул композиционных материалов, полученных с применением механического легирования</i>
<u>Попов В.А.</u> , Котов А.Д.	<i>Исследование структуры металломатричных композитов с упрочняющими наночастицами карбида титана, полученными "in-situ" синтезом в алюминиевой матрице при механическом легировании</i>
<u>Привезенцев В.В.</u> , Палагушкин А.Н., Скуратов В.А., Куликаускас В.С., Букунин К.А., Бурмистров А.В., Зилова О.С., Штейнман Э.А., Терещенко А.Н.	<i>Исследование пленки диоксида кремния, имплантированной Zn и облученной быстрыми ионами Хе</i>
<u>Пронин В.П.</u> , Долгинцев Д.М., Каптелов Е.Ю., Сенкевич С.В., Пронин И.П.	<i>Структура, состав и диэлектрические свойства тонких пленок PZT в области морфотропной фазовой границы</i>
<u>Рау Э.И.</u> , Смоляр В.А., Караулов В.Ю., Зайцев С.В., Мхитарян В.М.	<i>Определение средней энергии и коэффициента отраженных электронов в зависимости от угла их выхода</i>
Росляков И.В., Калинин И.А., Напольский К.С.	<i>Рекристаллизация тонких пленок платины для создания устройств микроэлектроники нового поколения</i>
<u>Румянцев А.В.</u> , Боргардт Н.И.	<i>Моделирование формирования микро- и наноструктур фокусированным ионным пучком методом функций уровня</i>
Рыбалко В.В., Кулинич В.И.	<i>РЭМ-исследование слоев нитрида титана, наносимых на внутренние поверхности каналов</i>
<u>Сазонов В.А.</u> , Боргардт Н.И., Кукин В.Н., Казаков И.П.	<i>Анализ мозаичной структуры низкотемпературного арсенида галлия методами просвечивающей растровой электронной микроскопии</i>
Свинцов А.А., Якимов Е.Б., Дорохин М.В., Дёмина П.Б., Шенгуров В.Г., Звонков Б.Н.	<i>Моделирование параметров бетавольтаического элемента на основе тритида титана</i>
Смирнов А.В., Аткин В.С., Горбачёв И.А., Вениг С.Б.	<i>Сканирующая электронная микроскопия в исследовании металл - полимерных композиционных материалов</i>
Соколов Л.В., Агафонова Н.А.	<i>Исследование упругих напряжений на границах раздела КНИ гетероструктуры микроэлектромеханического преобразователя давления с изолированной тензорамкой</i>
<u>Станчик А.В.</u> , Константинов С.В., Башкиров С.А., Гременок В.Ф., Петлицкий А.В., Петлицкая Т.В., Хорошко В.В.	<i>Анализ химического состава пленок $Cu_2ZnSnSe_4$ на гибких подложках методом резерфордского обратного рассеяния</i>
<u>Суродин С.И.</u> , Шоболов Е.Л.,	<i>Подготовка поперечных сколов для РЭМ методом</i>

Николичев Д.Е.	<i>трехлучевой ионной резки</i>
Чуева Т.Р., Молоканов В.В., Умнова Н.В., Умнов П.П.	<i>Исследование конструкционных аморфных проводов Со-сплава методом электронной микроскопии</i>
Юдинцева Т.И., Рашковский А.Ю., Дмитриева Т.Г., Радугин А.В.	<i>Исследование механизмов деформации и разрушения полимерного композита с углеродными нанотрубками in-situ при динамическом нагружении в РЭМ</i>
Якимов Е.Е., Якимов Е.Б.	<i>КЛ исследование гибридных органо-неорганических перовскитов, не содержащих Pb</i>
Якимов Е.Е., Яковлев А.Ю., Якимов Е.Б.	<i>Измерение диффузионной длины в Ga₂O₃</i>

Название секции. 5. Методы электронной микроскопии и микроанализа в исследовании предметов культурного наследия.

ФИО докладчика	Название доклада
Антонова Е.И., Кадикова И.Ф., <u>Макарова А.С.</u>	<i>Опыт использования электронной микроскопии для уточнения технологии ранее выполненных реставрационных работ на белокаменном портале бахчисарайского ханского дворца</i>
Курганов Н.С., <u>Петров Ю.В.</u> , Поволоцкая А.В., Панькин Д.В., Курочкин А.В.	<i>Исследование влияния процесса лазерной очистки на состав и микротопографию поверхности старинных монет</i>
Лобзова Р.В., Магазина Л.О., Макарова А.С., Мاستыкова А.В.	<i>Исследование материала глазурованной керамики с помощью сканирующего электронного микроскопа.</i>
<u>Шибанова И.Н.</u> , Писарева С.А., Чайкина Ю.В.	<i>Электронная микроскопия как один из методов в экспертизе произведений живописи</i>
<u>Юрьева Т.В.</u> , Афанасьев И.Б., Кадикова И.Ф., Морозова Е.А., Григорьева И.А., Лукашова М.В., Ключникова Д.О., Малыхин С.А., Уваров О.В., Юрьев В.А.	<i>Коррозия и разрушение стекла цветного бисера XIX века: исследование методами электронной микроскопии</i>

Название секции. 6. Сканирующая зондовая микроскопия

ФИО докладчика	Название доклада
<u>Валиев Х.Х.</u> , Минаев А.Я., Степанов Г.В., Карнет Ю.Н., Юмашев О.Б.	<i>Сканирующая зондовая микроскопия магнитореологических эластомеров</i>
<u>Валуева С.В.</u> , Вылегжанина М.Э.	<i>Влияние природы полимерного стабилизатора на морфологические, молекулярно-конформационные и спектральные параметры селенсодержащих наноструктур</i>
Воробьев В.В., Рогов А.М., Осин Ю.Н., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Степанов А.Л.	<i>Характеризация распыления поверхности кремния при имплантации ионами серебра методом сканирующей зондовой микроскопии</i>
<u>Гайнутдинов Р.В.</u> , Волк Т.Р.,	<i>Особенности процессов переключения в сегнетоэлектрических кристаллах в поле зонда</i>

Боднарчук Я.В., Симагина Л.В.	<i>атомно-силового микроскопа</i>
Гайнутдинов Р.В., <u>Толстихина А.Л.</u> , Селезнева Е.В., Макарова И.П.	<i>АСМ-исследование новых сегнетоэлектрических кристаллов кислого сульфата аммония-калия</i>
Глухов В.С.	<i>Использование преобразования Фурье при анализе изображений доменной структуры кристаллов семейства триглицинсульфата</i>
<u>Губанова Г.Н.</u> , Вылегжанина М.Э., Волков А.Я., Кузнецов Д.А., Кононова С.В.	<i>АСМ исследование морфологии непористых пленок и микропористых мембран на основе сополиамидоимидов</i>
Еременко В.Г.	<i>Особенности возникновения, структура и электрические свойства гексагонального Si-IV кремния</i>
Ермолаева О.Л., Скороходов Е.В., Сапожников М.В., Володин А.П., Миронов В.Л.	<i>Влияние ориентации магнитного момента зонда магнитно-резонансного силового микроскопа на спектры спин-волновых резонансов</i>
Жуйков В.А., Бонарцев А.П., Бонарцева Г.А.	<i>Изучение гидролитической деградации поли-3-оксибутирата методом атомно-силовой микроскопии.</i>
Каминская Т.П., Тихонов А.И., Шипко М.Н., <u>Степович М.А.</u>	<i>Атомная силовая микроскопия поверхности фольги электротехнической стали</i>
Климин В.С., Резван А.А.	<i>Исследование применения локального анодного окисления с последующим плазмохимическим травлением для формирования устройств наноэлектроники</i>
Коньшин А.А., Ильина М.В., Ильин О.И.	<i>Исследование влияния диаметра пучка деформированных углеродных нанотрубок на величину поверхностного потенциала</i>
<u>Криничная Е.П.</u> , Иванова О.П., Завьялов С.А., Кривандин А.В., Журавлева Т.С.	<i>Исследование методом атомно-силовой микроскопии поверхностной структуры тонких пленок полимерных нанокомпозитов ППК+PbSe</i>
<u>Криничная Е.П.</u> , Иванова О.П., Завьялов С.А., Журавлева Т.С.	<i>Топография поверхности полимерных нанокомпозитов на основе поли-п-ксилилена и сульфидов металлов</i>
Кутровская С.В., <u>Шагурина А.Ю.</u> , Лелекова А.Ф., Новикова О.А., Кель А.В.	<i>Метод индуцированного осаждения планарных наноструктур на базе зондовой нанолаборатории NTEGRA Aura</i>
<u>Местер А.Ю.</u> , Орехова К.Н., Серов Ю.М., Дементьев П.А., Попова Т.Б., Заморянская М.В.	<i>Формирование углеводородной плёнки на поверхности материалов при облучении электронным пучком</i>
<u>Муслимов А.Э.</u> , Буташин А.В., Старчиков С.С., Каневский В.М.	<i>Зондовая микроскопия и спектроскопические исследования вакуумной термодеструкции поверхности кристаллов SiC при синтезе графена в потоке железа</i>
<u>Муслимов А.Э.</u> , Буташин А.В., Каневский В.М.	<i>Применение зондовой микроскопии для изучения электрофизических свойств и структурной перестройки поверхности кристаллов V₂O₅ в процессе вакуумного отжига</i>
<u>Муслимов А.Э.</u> , Буташин А.В.,	<i>Магнитно-силовая микроскопия пленок ферритов</i>

Каневский В.М.	<i>висмута, никеля, кобальта</i>
Муслимов А.Э., Буташин А.В., Каневский В.М.	<i>Зондовая и электронная микроскопия селективно-фотопроводящих пленок β-Ga₂O₃- In₂O₃, полученных твердофазной эпитаксией</i>
Николаев А.Н., Баньковская И.Б., Пугачев К.Э., Коловертнов Д.В.	<i>Исследование структуры поверхности покрытий на основе композиции Si-B₄C-ZrB₂</i>
Новак А.В., Новак В.Р.	<i>Эволюция морфологии поверхности при анизотропном травлении кремния</i>
Покотило Ю.М., Петух А.Н., Смирнова О.Ю., Королик О.В., Мазаник А.В., Маркевич В.П., Гиро А.В., Гременок В.Ф., Стельмах Г.Ф.	<i>Формирование водородных пузырей в гидрогенизированном кремнии при термообработке</i>
Рогов А.М., Воробьев В.В., Осин Ю.Н., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Степанов А.Л.	<i>Сканирующая зондовая микроскопия и спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния германиевых слоев, имплантированных ионами серебра</i>
Сазанова Т.С., Отвагина К.В., Воротынцева И.В.	<i>Особенности структурообразования поверхности полимерных мембран на основе хитозана по данным атомно-силовой микроскопии</i>
Степанцов Е.А.	<i>Выращивание и исследование поверхности бикристаллических пленок YBa₂Cu₃O₇ с изгибом SiO-плоскостей до 90°</i>
Тикото С.Э., Тиванов М.С., Гременок В.Ф., Хорошко В.В.	<i>Влияние отжига на микроструктуру тонких пленок In₂S₃, полученных методом термического испарения</i>
Толстихина А.Л., Гайнутдинов Р.В., Белугина Н.В., Рощин Б.С., Золотов Д.А., Асадчиков В.Е., Шут В.Н., Мозжаров С.Е., Кашевич И.Ф.	<i>Исследование ростовой периодической примесной структуры кристаллов TGS методами сканирующей зондовой микроскопии и рентгеновских методов анализа</i>

Название секции. 8. Электронная и ионная литография. Микроскопия в современных технологиях.

ФИО докладчика	Название доклада
Григорьев Е.А., Петров Ю.В., Барабан А.П., Шаров Т.В.	<i>Локальное управление скоростью химического травления диоксида кремния при помощи гелиевого ионного микроскопа</i>
Зайцев С.И., Князев М.А., Свинцов А.А.	<i>Расчет распределения поглощенной энергии электронов методом Монте-Карло и представление функции близости тремя параметрами α, β, η</i>
Ильин А.И., Иванов А.А., Трофимов О.В., Фирсов А.А., Никулов А.В., Тулин В.А., Зотов А.В.	<i>Изготовление и электрические характеристики ассиметричных колец из ВТСП YBCO пленок, полученных методом импульсного лазерного напыления</i>
Князев М.А., Свинцов А.А., Фахртдинов Р.Р., Рошупкин Д.В.	<i>Развитие методов электронно-лучевой литографии для создания периодических рентгеновских дифракционных элементов</i>
Коханчик Л.С., Шандаров С.М., Волк Т.Р.	<i>Формирование периодических доменных структур при электронном облучении волноводов Ti:LiNbO₃</i>

Коханчик Л.С., Волк Т.Р.	<i>Особенности записи доменных структур электронным лучом в кристаллах $LiNbO_3$ с повышенной проводимостью</i>
Лапин Д.Г., Овчинников И.С.	<i>Зависимость удельного сопротивления нанопроводов из вольфрама от параметров локального ионно-лучевого осаждения</i>
Михайлов М.С., Марголин Б.З., Петров С.Н., Печенкин В.А., Сорокин А.А.	<i>Оценка радиационной повреждаемости материалов для ВКУ после имитационного облучения ионами никеля</i>
Панченко И.В., Шандыба Н.А., Коломийцев А.С.	<i>Формирование элементов автоэмиссионной наноэлектроники методом фокусированных ионных пучков</i>

Название секции. 9. Электронная микроскопия в химии, геологии и метеоритоведении.

ФИО докладчика	Название доклада
Кузьмин В.А., Скибицкая Н.А., Большаков М.Н.	<i>Структура порового пространства пород нижнемеловых отложений (K_1) Восточно – Бирюзакской площади</i>
Кузьмин В.А., Скибицкая Н.А.	<i>Особенности микростроения глубокозалегающих карбонатно-кремнистых пород</i>
Лемазина Ю.А., Юсупова А.Р., Кузина Д.М., Воробьев В.В., Марков Г.П.	<i>Микрометеориты из оз. Тургояк</i>
Округин В.М., Козлов В.В., Кудяева Ш.С., Малик Н.А., Плутахина Е.Ю., Каримова О.В., Карташов П.М., Москалева С.В., Чубаров М.В., Лукашева М.В., Брюггер Д., Этшман Б.	<i>Наталиямаликит и новограбленовит – новые минералы в продуктах современной вулканической деятельности Камчатки</i>
Сергиенко Е.С., Янсон С.Ю., Флоренский П.В., Харитонский П.В., Костеров А.А., Гордюшин Д.С.	<i>Микровключения в иргизитах</i>
Скибицкая Н.А., Кузьмин В.А.	<i>Создание керновых моделей с учетом микроструктурных особенностей порового пространства пород</i>
Скибицкая Н.А., Кузьмин В.А., Судьин В.В.	<i>Исследование органического вещества в породах-коллекторах нефти и газа в РЭМ.</i>
Татаринов В.В., Финкельштейн А.Л., Павлова Л.А.	<i>Способ определения пробности тонкодисперсного золота в сульфидных минералах методом РСМА</i>
Юсупова А.Р., Косарева Л.Р., Воробьев В.В.	<i>Электронная сканирующая микроскопия при изучении магнитной фракции донных отложений на примере озер Южного Урала</i>

Название секции. 10. Другие применения электронной микроскопии и комплементарных методов.

ФИО докладчика	Название доклада
Аксенов О.И., Орлова Н.Н., Аронин А.С.	<i>Изучение корреляции магнитной и атомной структуры и гистерезисных свойств микропроводов</i>
<u>Алехин Ю.В.</u> , Макарова М.А., Козаченко Е.А., Шипилова Е.С., Ивлева Е.А.	<i>Исследование мембранных материалов с помощью электронной микроскопии</i>
Анашкина Н.Е., <u>Бунин И.Ж.</u> , Копорулина Е.В.	<i>Изучение механизма импульсных энергетических воздействий на природные технические алмазы (РЭМ-РСМА, АСМ и ИКФС)</i>
<u>Артемов В.В.</u> , Давыгора А.П., Сыров Ю.В.	<i>Морфология и состав сульфидов индия и сурьмы, образующихся при взаимодействии серы с антимонидом индия</i>
Васильева В.И., Голева Е.А., Смагин М.А., Абрамова Е.О.	<i>РЭМ исследование структурных особенностей профилированной сульфокатионообменной мембраны в растворах алкилароматической аминокислоты</i>
<u>Горбунов Д.С.</u> , Нищев К. Н., Мишкин В.П., Лютова Е.Н., Долганов А.В.	<i>Применение РЭМ и СЗМ для исследования особенностей процессов анодирования алюминия</i>
<u>Грипанцева Е.С.</u> , Шевченко В.П., Боев А.Г., Федорова Л.П.	<i>Опыт применения электронной микроскопии при эколого-геохимических исследованиях взвеси Ивановского водохранилища</i>
Гуляев А.И., Зайцев Д.В.	<i>Микроструктурный и фрактографический анализ полимерных материалов авиационного назначения</i>
<u>Ермаков М.А.</u> , Гончаров А.В., Ким Е.Д.	<i>Исследование интерметаллидных соединений Al-Ni-РЗМ в комплексных лигатурах для алюминиевых сплавов систем Al-Si и Al-Cu</i>
Исхакова Л.Д., Милович Ф.О., Лукашова М.В., Сомов П.А., Вельмискин В.В., Пластинин Е.А.	<i>Исследование микроструктуры и состава допированных висмутом пористых стёкол для изготовления волоконных световодов</i>
Кулинич В.И., Бубликов Е.И., Коломиец В.В., Лялько Е.С., Чертова И.А.	<i>Применение методов ПЭМ при формировании сегментированных магнитных наноструктур</i>
<u>Ловыгин М.В.</u> , Казанский П.Р., Рашковский А.Ю., Марясев И.Г., Мамлеев Р.Ф.	<i>Комплексная характеристика структуры керметов на основе карбида титана</i>
<u>Михуткин А.А.</u> , Камышинский Р.А., Орехов А.С., Тенчурин Т.Х., Григорьев Т.Е., Чвалун С.Н., Васильев А.Л.	<i>Трёхмерная реконструкция и анализ биосовместимых матриц по данным конфокальной лазерной сканирующей и растровой электронной микроскопии</i>
<u>Морозова Л.В.</u> , Григоренко В.Б.	<i>Исследование причин разрушения крыльчатки и колеса вентилятора из сплава АК4-1</i>
Посельская Ю.В., Викторов В.В., Белая Е.А.	<i>Исследование морфологии оксигидратов алюминия, полученных гидролизом в присутствии ПАВ</i>
Соколов Л.В., Агафонова Н.А.	<i>Исследование упругих напряжений на границах раздела КНИ гетероструктуры микроэлектромеханического преобразователя давления с изолированной тензорамкой</i>

Соколов В.Н., Чернов М.С., Кузнецов Р.А., Разгулина О.В., Денисова Л.Г., Юрковец Д.И.	<i>Применение электронной микроскопии и компьютерной томографии при деформационных испытаниях глинистых грунтов</i>
<u>Станчик А.В.</u> , Константинов С.В., Башкиров С.А., Гременок В.Ф., Петлицкий А.В., Петлицкая Т.В., Хорошко В.В.	<i>Анализ химического состава пленок $Cu_2ZnSnSe_4$ на гибких подложках методом резерфордского обратного рассеяния</i>
Степанцов Е.А.	<i>Выращивание и исследование поверхности бикристаллических пленок $YBa_2Cu_3O_7$ с изгибом CuO-плоскостей до 90°</i>
<u>Федорец А.</u> , Привар Ю., Малахова И., Модин Е., Братская С.	<i>Полиэтилениминовые криогели для сорбции ионов металлов</i>
Чернов М.С., Соколов В.Н., Крупская В.В.	<i>Микроморфологические исследования осадка наночастиц природных глинистых грунтов</i>
Шефтель Е.Н., <u>Теджетов В.А.</u> , Жигалина О.М., Харин Е.В., Кирюханцев-Корнеев Ф.В., Усманова Г.Ш., Хмеленин Д.Н.	<i>Исследование нанокристаллической структуры магнитномягких пленок $Fe-Zr-N$ и $Fe-Ti-B$ методами просвечивающей электронной микроскопии и рентгеновской дифракции</i>
Шипко М.Н., <u>Степович М.А.</u> , Сибирев А.Л.	<i>О возможности использования киловольтных электронов для изучения структуры жидких объектов</i>